

### Modelo de Resumo

Este é um modelo de Resumo redigido **em inglês** para o livro de Resumos do IX Encontro da SBPMat.

O Resumo deve estar contido em **apenas** uma página A4 (210 mm x 297 mm, retrato, margens superior e inferior 3 cm e margens direita e esquerda 2,5 cm).

Favor sublinhar o nome do autor apresentador do trabalho e colocar o endereço eletrônico e o endereço de contato na última linha, logo após as referências. Coloque também uma lista de palavras-chave.

Favor não numerar a página nem usar cabeçalho e rodapé.

Usar espaçamento simples, font Times New Roman 12 para todo o texto e font 18 para o título. Para instruções adicionais e como submeter o Resumo, acessar a página <http://sbpmat.org.br/10encontro>.

Solicitamos preparar o Resumo em arquivo word e colar gráficos e fotos (se necessário). Para referências, veja modelo abaixo.

**Após verificar cuidadosamente o texto, transforme-o em pdf e submeta. Não haverá edição do texto após sua submissão.**

**Abstract guidelines: see model below**

3 cm

## Local structure of FePt thin films investigated by polarized X-ray absorption spectroscopy

A. Martins<sup>1</sup>, R. J. Prado<sup>2</sup>, M. C. A. Fantini<sup>3</sup>, N. M. Souza-Neto<sup>3,4</sup>, A. D. Alvarenga<sup>3</sup>, A. Y. Ramos<sup>5</sup> and A. D. Santos<sup>3</sup>

<sup>1</sup>*Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí, GO, Brazil*

<sup>2</sup>*DRM, ICET, Universidade Federal de Mato Grosso, Brazil*

<sup>3</sup>*IF, Universidade de S. Paulo, S. Paulo, SP, Brazil*

<sup>4</sup>*Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, Campinas, SP, Brazil*

<sup>5</sup>*Laboratoire Louis Néel, France*

The structure of FePt films have been studied by X-ray Absorption Spectroscopy (XAS). The purpose of this work is to quantify the local structural anisotropy, correlating with the macroscopic magnetic anisotropy of these films. In the XAS measurements, the sample orientation was varied with respect to the linearly polarized X-ray beam. This procedure allows obtaining more precise information about the local structure around the absorber atom. The results show that the short range chemical order inside the samples is highly dependent on the deposition procedure, growth temperature and substrate.

Keywords: Magnetic multilayer, sputtering, interfaces, XMCD, induced moments,

Work supported by xxx.

[1] B. T. Thole, P. Carra, F. Sette, G. van der Laan, Phys. Rev. Lett. **68**, 1943 (1992).

[2] M. Tischer, O. Hjortstam, D. Arvanitis, O. Eriksson, Phys. Rev. Lett. **75**, 1602 (1995).

[3] D. Tabor, "The Hardness of Metals", Clarendon, Oxford, U.K., 1951.

[4] X. Y. Silva, Filmes Finos Investigados por Luz Polarizada, M.Sc. Dissertation, UFMG, Belo Horizonte, 2010.

*e-mail e endereço do autor correspondente*

**abstracts only in English**

**only one page (A4 size)!**

**no header, foot note or page number**

**underline presenting author**

**e-mail address of corresponding author below references**

**keywords below text**

**simple space / times new roman 18 for title and 12 for text**

**submit abstract in pdf file only !!!**

2.5  
cm

2.5  
cm

3 cm